CFO 13988 US November 11, 2004

Excerpt translation of JP-H09-252434-A

[0041] Fig. 6 shows timing charts illustrating the operation of this embodiment. In Fig. 6(a), during the horizontal blanking period, the electric potentials of the address line 6, the RD line 15 and the reset gates are set respectively to "H", "L" and "H" to inject an electric charge. Then, the RD line 15 is set to "H" and the reset gates are again set to "H" to discharge an electric charge. Thereafter, the read-out gates are turned on to read out the signal.

[0042] In this operation, the signal detecting sections 20 connected to the gates of the amplifying transistors 2 are reset by injection and discharge of an electric charge. Hence, KTC noise generated at the signal detecting sections 20 is lowered to 1/2 KTC. In this event, signal charges stored at the photodiodes 1 should preferably be completely transferred by turning on the read-out transistors 16.

[0043] In Fig. 6(b), during the horizontal blanking period, the electric potentials of the address line 6, RD line 15 and the reset gates are set respectively to "H", "L" and "H" to inject an electric charge. Then, the RD line 15 is set to "H" and the reset gates are again set to "H" to discharge an electric charge at the gate portions of the amplifying transistors. Thereafter, the read-out transistors are turned on to read out the signal.

[0044] Next, the electric potentials of the RD line 15, the reset gates and the read-out gates are set to "L", "H" and "H" to inject an electric charge to the photodiode sections. Then, the RD line 15 is set to "H", the reset gates are again set to "H" and the read-out gates are again set to "H" to discharge an electric charge.

[0045] In this operation, both the signal detecting sections 20 and the photodiodes 1 are reset by the injection and discharge of an electric charge to reduce the KTC level to 1/2 KTC. At the same time, any after images caused by incomplete transfer of signal charges from the photodiodes can be suppressed.

[0046] In Fig. 6(c), during the horizontal blanking period,

CFO 13988 US November 11, 2004

the electric potentials of the address line 6, the RD line 15 and the reset gates are set respectively to "H", "H" and ""H" to discharge an electric charge. Thereafter, the read-out gates are turned on to read out the signal. Then, the RD line 15 is set to "L", the reset gates are set to "H", and the read-out gates are again turned on to inject an electric charge. Then, the RD line 15 is set to "H", the reset gates are set to "H", and the read-out gates are again turned on to discharge an electric charge.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-252434

(43)公開日 平成9年(1997)9月22日

 (51) Int.Cl.*
 酸別配号
 庁内整理番号
 FI
 技術表示箇所

 H 0 4 N 5/335
 H 0 4 N 5/335
 E

 H 0 1 L 27/146
 H 0 1 L 27/14
 A

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 11 頁)

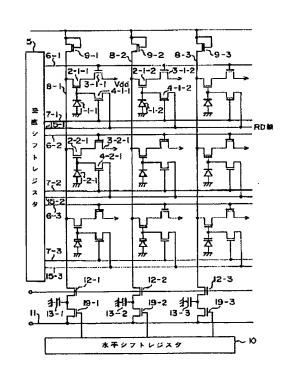
•			
(21)出願番号	特顏平8-57720	(71)出顧人	000003078 株式会社東芝
(22) 出願日	平成8年(1996)3月14日		神奈川県川崎市幸区堀川町72番地
		(72)発明者	宮川 良平
			神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株
			式会社東芝研究開発センター内
		(72) 発明者	山下 治史
			神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株 式会社東芝研究開発センター内
		(74)代理人	介理士 鈴江 武彦
		1117	

(54) 【発明の名称】 固体摄像装置

(57)【要約】

【課題】 フォトダイオード部で発生するノイズを低減させることができ、S/Nの向上をはかる。

【解決手段】 半導体基板上に、光電変換のためのフォトダイオード1, このフォトダイオード1の出力をゲートに入力する増幅トランジスタ2, 及びフォトダイオード1をリセットするリセットトランジスタ4を含む単位セルを行列2次元状に配列してなる撮像領域と、この撮像領域の読み出し行を選択する垂直シフトレジスタ5と、選択された行に相当するフォトダイオード1の検出信号を競み出す列方向に配置された水平信号線11に検出信号を順次読み出す水平選択トランジスタ19とを備えた固体撮像装置において、リセットトランジスタ4のフォトダイオード1につながる端子と反対側の端子の配線(RD線)15が、行方向に延び且つ各行の配線が電気的に独立している。



特開平9-252434

(2)

20

[特許請求の範囲]

【請求項1】半導体基板上に、フォトダイオードとこの ダイオードをリセットする手段を含む単位セルを行列2 次元状に配列してなる撮像領域と、この撮像領域の読み 出し行を選択する垂直選択手段とを備えた固体撮像装置 において、

1

前記フォトダイオードのリセット手段が、前記フォトダ イオードへの電荷の注入と排出によることを特徴とする 固体操像装置。

ダイオード、このフォトダイオードの出力をゲートに入 力する増幅トランジスタ、及びフォトダイオードをリセ ットするリセットトランジスタを含む単位セルを行列2 次元状に配列してなる撮像領域と、この撮像領域の読み 出し行を選択する垂直選択手段と、選択された行に相当 するフォトダイオードの検出信号を読み出す列方向に配 置されて増幅トランジスタのソースに接続された垂直信 号線と、これらの垂直信号線から行方向に配置された水 平信号線に検出信号を順次読み出す水平選択トランジス タとを備えた固体撮像装置において、

前記リセットトランジスタの前記フォトダイオードにつ ながる端子と反対側の端子の配線が行方向に延び、且つ 各行の配線が電気的に独立していることを特徴する固体 撮像装置。

【請求項3】半導体基板上に、光電変換のためのフォト ダイオードとこのフォトダイオードの出力をゲートに入 力する増幅トランジスタを有する単位セルを行列2次元 状に配列してなる撮像領域と、この撮像領域の読み出し 行を選択する垂直選択手段と、選択された行に相当する セルの検出信号を読み出す列方向に配置されて前記増幅 30 トランジスタのソースに接続された複数の垂直信号線 と、これらの垂直信号線から行方向に配置された水平信 号線に検出信号を順次読み出す水平選択トランジスタと を備えた固体撮像装置において、

前記増幅トランジスタのドレインが電荷注入線に接続さ れ、電荷注入線電位が増幅トランジスタのゲートのチャ ネル電位より低い電位に設定されることで、電荷注入線 から垂直信号線へ電荷が注入され、その後に垂直信号線 電位より高い電位に設定されることにより信号の読み出 しが行われることを特徴とする固体撮像装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、固体撮像装置に係 わり、特に単位セル内に増幅トランジスタを設けた増幅 型固体撮像装置に関する。

[0002]

[従来の技術] 近年、固体撮像装置の一つとして、増幅 型MOSセンサを用いた固体撮像装置が提案されてい る。この装置は、各セル毎にフォトダイオードで検出し た光信号を、トランジスタで増幅するものであり、高感 50 れる。一般には、C v はC s に比べ非常に大きい。

度という特徴を持っている。

【0003】図10は、増幅型MOSセンサを用いた従 来の固体撮像装置を示す圓路構成図である。フォトダイ x-F1 (1-1-1, 1-1-2, \sim , 1-3-3) の検出信号を増幅する増幅トランジスタ2(2-1-1,2-1-2,~,2-3-3)、信号を読み出すう インを選択する垂直選択トランジスタ3(3-1-1, 3-1-2, ~、3-3-3)、信号電荷をリセットす るリセットトランジスタ4(4-1-1,4-1-2, 【請求項2】半導体基板上に、光電変換のためのフォト 10 ~,4-3-3)からなる単位セルが行列2次元状に配 列されている。なお、図では3×3個のセルが配列され ているが、実際にはこれより多くの単位セルが配列され

> 【0004】垂直シフトレジスタ5から水平方向に配線 されている水平アドレス線6(6-1,6-2,6-3) は垂直選択トランジスタ3のゲートに接続され、信 号を読み出すラインを決めている。同様に、垂直シフト レジスタ5から水平方向に配線されているリセット線7 (7-1, 7-2, 7-3) は、リセットトランジスタ 4のゲートに接続されている。増幅トランジスタ2のソ ースは列方向に配置された垂直信号線8(8-1,8-2,8-3)に接続され、その一端には負荷トランジス タ9 (9-1, 9-2, 9-3) が設けられている。 【0005】垂直信号線8の他端は、水平シフトレジス タ10の選択パルスにより駆動される水平選択トランジ スタ19 (19-1, 19-2, 19-3)を介して水 平信号線11に接続されている。

> 【0006】図11は、このデバイスの動作を示すタイ ミングチャートである。水平アドレス線6-1をハイレ ベルにするアドレスバルス101を印加すると、このラ インの垂直選択トランジスタ3のみONし、このライン の増幅トランジスタ2と負荷トランジスタ9でソースホ ロア回路が構成される。そして、増幅トランジスタ2の ゲート電圧、即ちフォトダイオード1の電圧とほぼ同等 の電圧が垂直信号線8に現れる。

【0007】次いで、水平シフトレジスタ10から水平 選択パルス102(102-1, ~, 102-3)を水 平選択トランジスタ19に順次印加し、水平信号線11 から1ライン分の信号を順次取り出す。1ライン分の信 40 号の読み出しが終わるとリセット線7-1をハイレベル にするリセットパルス103を印加し、このラインのリ セットトランジスタ4をONして信号電荷をリセットす る。

【0008】との動作を、次のライン、その次のライン と順次続けるととにより、2次元状全ての信号を読み出 すととができる。ことで、フォトダイオード1の電位の 変化分とほぼ同等の変化分の電圧が垂直信号線8に現れ る。フォトダイオード 1 の容量をC s 、垂直信号線 8 の 容量をCvとすると、信号電荷はCv/Cs倍に増幅さ

(3)

20

[0009] しかしながら、この種の装置にあっては次 のような問題があった。即ち、従来型の特徴はリセット トランジスタのドレインの配線が全てのラインで共通 で、電源線Vadに接続されていることである。この構成 では、フォトダイオードのリセットはリセットトランジ スタが強反転であるため、フォトダイオードで発生する ノイズは2/3KTCである(K:ボルツマン定数、 T:絶対温度、C:フォトダイオードの容量)。そして この雑音は、固体撮像装置の感度を低下させる。

[0010]また、撮像領域端に負荷トランジスタを設 10 置する必要があるため、その分素子面積が大きくかつ素 子製造工程が複雑化するという問題があった。さらに、 ソースフォロワ動作では、負荷トランジスタを介して全 ての垂直信号線に電流が流れているため、負荷トランジ スタの抵抗で消費される電力が素子の消費電力を大きく しているという問題があつた。さらに、負荷トランジス タは各列1つずつ設けられるが、負荷トランジスタの特 性がはらつくと、負荷トランジスタと画素の増幅トラン ジスタで構成されるソースホロアの特性が列毎にばらつ くため、再生画面上で縦の節状に出力が不均一になり、 画質が著しく劣化すると言う問題があった。

【0011】また、上記の問題の他に次のような問題も あった。第16、水平方向で信号の蓄積時間が異なるた め感度の差がでることである。これは、リセットする時 間は1ラインの中は全て同時であるが信号を読み出す時 間は異なっているためである。図6でフォトダイオード 1-1-1, ~, 1-1-3の信号蓄積時間104-1. ~, 104-3は、1周期の時間105に比べ短い だけでなくそれぞれ異なっている。

【0012】第2に、フォトダイオード1の電位が同じ でも増幅トランジスタ2のしきい値電圧の違いが垂直信 号線8に現れるため、しきい値電圧のばらつきに対応す る2次元状の雑音(固定パターン雑音と呼ぶ)が現れる ことである。しきい値電圧は増幅トランジスタ2のドレ イン電流が殆ど流れない状態(1マイクロアンペア程 度)で測定する。しかし、増幅トランジスタ2は電流供 **給源の負荷トランジスタ9からその20倍から1000** 倍のドレイン電流を流している。そのため、しきい値電 圧のばらつきだけでなくドレイン電流が大きいところで のトランジスタ特性のばらつきも固定パターン雑音とな 40 る。

[0013]

【発明が解決しようとする課題】とのように従来、増幅 型固体撮像装置においては、フォトダイオードのリセッ トに伴いフォトダイオード部で発生するKTCノイズが あり、これが間体撮像装置の感度を低下させる大きな要 因となっていた。

【0014】また、負荷トランジスタを各垂直信号線に 設置する必要があり、素子面積の増大と共に消費電力の 増大を招くという問題があった。本発明は、上記事情を 50 ダイオードの出力をゲートに入力する増幅トランジスタ

考慮して成されたもので、その目的とするところは、フ ォトダイオード部で発生するKTCノイズを低減させる ことができ、S/Nの高い増幅型固体撮像装置を提供す ることにある。

【0015】また、本発明の他の目的は、増幅トランジ スタのソースに接続された負荷トランジスタを省略する ととができ、素子面積の縮小及び消費電力の低減をはか り得る増幅型固体撮像装置を提供することにある。 [0016]

【課題を解決するための手段】

(構成) 上記課題を解決するために本発明は、次のよう な構成を採用している。即ち、本発明(請求項1)は、 半導体基板上に、フォトダイオードとこのダイオードを リセットする手段を含む単位セルを行列2次元状に配列 してなる撮像領域と、この撮像領域の読み出し行を選択 する垂直選択手段とを備えた固体撮像装置において、前 記フォトダイオードのリセット手段が、前記フォトダイ オードへの電荷の注入と排出によることを特徴とする。 【0017】また、本発明(請求項2)は、半導体基板 上に、光電変換のためのフォトダイオード、このフォト ダイオードの出力をゲートに入力する増幅トランジス タ、及びフォトダイオードをリセットするリセットトラ ンジスタを含む単位セルを行列2次元状に配列してなる 撮像領域と、この撮像領域の読み出し行を選択する垂直 選択手段と、選択された行に相当するフォトダイオード の検出信号を読み出す列方向に配置されて増幅トランジ スタのソースに接続された垂直信号線と、これらの垂直 信号線から行方向に配置された水平信号線に検出信号を 順次読み出す水平選択トランジスタとを備えた固体撮像 装置において、前記リセットトランジスタの前記フォト ダイオードにつながる端子と反対側の端子の配線(リセ ットドレイン配線)が行方向に延び、且つ各行の配線が 電気的に独立していることを特徴する。

【0018】ととで、本発明の望ましい実施態様として は、次のものがあげられる

- (1) リセットドレイン配線が、同じ行の増幅トランジス タのドレインにつながる配線と共通であること。
- (2) リセットドレイン配線が、隣合う上或いは下の行の 増幅トランジスタのドレインにつながる配線と共通であ
- (3) リセットトランジスタのドレイン配線の電位を変化 させることにより、フオトダイオードに電荷を注入及び 排出して、フォトダイオードのリセットを行うこと。
- (4) フォトダイオードが読み出しトランジスタを介して 増幅トランジスタのゲートにつながること。
- (5) フォトダイオードが埋め込み型フォトダイオードで
- 【0019】また、本発明(請求項3)は、半導体基板 上に、光電変換のためのフォトダイオードとこのフォト

(4)

を有する単位セルを行列2次元状に配列してなる撮像領域と、この撮像領域の読み出し行を選択する垂直選択手段と、選択された行に相当するセルの検出信号を読み出す列方向に配置されて前記増幅トランジスタのソースに接続された複数の垂直信号線と、これらの垂直信号線から行方向に配置された水平信号線に検出信号を順次読み出す水平選択トランジスタとを備えた固体撮像装置において、前記増幅トランジスタのドレインが行毎に独立に設置された電荷注入線に行方向に共通に接続され、選択された行の信号の読み出しは、電荷注入線電位が増幅ト 10ランジスタのゲートのチャネル電位より低い電位に設定された後に、垂直信号線電位より高い電位に設定された後に、垂直信号線電位より高い電位に設定されるととを特徴とする。

(作用) 本発明(請求項1,2)によれば、電荷の注入・排出動作によりフォトダイオードをリセットすることにより、リセットトランジスタが弱反転状態でリセットされるため、雑音は1/2KTCに減少する。

【0020】より具体的には、リセットトランジスタのドレインの配線(リセットドレイン配線: R D線)を、選択トランジスタを介して増幅トランジスタのドレイン 20 につながる配線とは独立に形成し、且つ各行で独立に配置することにより、R D線を"L"にして電荷の注入を行い、R D線を"H"にして電荷の排出を行うという注入・排出動作によつて、フォトダイオードのリセットを行うととができる。つまり、リセットトランジスタを強反転状態ではなくが弱反転状態でリセットするために、雑音を1/2KTCに減少させることができる。

【0021】また、本発明(請求項3)によれば、増幅トランジスタの信号を垂直信号線に読み出す際に、負荷トランジスタを通して電流を流さず、各行毎に独立して 30 設置された電荷注入線から垂直信号線に電荷を注入する。そのため、負荷トランジスタに電流を流す必要がなくなり、素子の消費電力を小さくすることができる。さらに、負荷トランジスタを設ける必要がないため、素子面積を小さくでき、素子製造工程を簡略化することができる。また、負荷トランジスタの特性ばらつきが原因で発生する再生画面上の縦節状の出力不均一を防止することができる。

[0022]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態を図面を 40 参照して説明する。

(第1の実施形態)図1は、本発明の第1の実施形態に 係わる固体撮像装置を示す回路構成図である。

【0023】単位セルの構成は、前記図10に示した従来装置と基本的に同様である。即ち単位セルは、フォトダイオード1の検出信号を増幅する増幅トランジスタ2、信号を読み出すラインを選択する垂直選択トランジスタ3、信号電荷をリセットするリセットトランジスタ4から構成され、行列2次元状に配列されている。なお、図では3×3個のセルが配列されているが、実際に50

はこれより多くの単位セルが配列されている。

【0024】垂直シフトレジスタ5から水平方向に配線されている水平アドレス線6は垂直選択トランジスタ3のゲートに接続され、信号を読み出すラインを決めている。同様に、垂直シフトレジスタ5から水平方向に配線されているリセット線7は、リセットトランジスタ4のゲートに接続されている。増幅トランジスタ2のソースは列方向に配置された垂直信号線8に接続され、その一端には負荷トランジスタ9が設けられている。

6

【0025】ととまでの基本構成は従来装置と同様であるが、本発明は次の点で従来装置と構成を異にする。即ち、リセットトランジスタ4のドレインの配線(RD線)15(15-1、15-2、15-3)は、選択トランジスタ3を介して増幅トランジスタ2のドレインにつながる電源線 V ddとは接続されておらず、電源線とは独立に設けられている。さらに、RD線15は各行で独立になっている。

【0026】また、垂直信号線8の他端は、分離トランジスタ12(12-1,12-2,12-3)に接続され、分離トランジスタ12と水平選択トランジスタ19との間に増幅容量13(13-1,13-2,13-3)が接続されている。なお、分離トランジスタ12及び増幅容量13を省略し、前記図10に示すように垂直信号線8を水平選択トランジスタ19に直接接続するようにしてもよい。

【0027】本実施形態では、リセットトランジスタ4のドレインの配線(RD線)15を電源線Vddとは独立に設け、さらにRD線15を各行で独立に配置している。このため、RD線15を"L"にして電荷を注入した後に"H"にして電荷を排出するという注入・排出動作によって、各行のフォトダイオード1のリセットを各行独立に行うことができる。この場合、リセットトランジスタ4が弱反転状態でリセットするために、フォトダイオード1で発生するノイズが1/2KTCに低減されることになる。

【0028】図2は、本実施形態における動作を示すタイミングチャートである。水平ブランキング期間に、信号読出しを行った後、RD線15の電位を"L"にし、リセットゲートを"H"にして電荷の注入を行う。その後、RD線15の電位を"H"にし、リセットゲートを再び"H"にして電荷の排出を行う。

【0029】 これによりリセットトランジスタ4を、例えばドレインが5 V でゲートが3 V という弱反転状態で駆動して注入動作を行うことができ、従ってフォトダイオード1 で発生するノイズを1/2 K T C に低減することができる。

【0030】また、本実施形態では、垂直信号線8と水平選択トランジスタ19との間に分離トランジスタ12 及び増幅容量13を設けることにより、信号蓄積時間を 1周期の時間に近付けるだけでなく、1ラインの中での (5)

蓄積時間の差を無くすことができ、これにより信号蓄積 時間の差による水平方向の感度の違いを無くすことも可 能となる。

【0031】図1の実施形態では各行独立にRD線15 を設けていた。しかし、RD線が全ての行に共通であっ ても図2の動作タイミングを用いて図1の実施形態と同 様の効果が得られる。但し、この場合は1つの行のフォ トダイオード1をリセットする時に全ての行のR D線を 駆動することになる。従って、各行のフォトダイオード 1をリセットする毎に全行のRD線の容量をドライブす 10 るととになり、消費電力が格段に大きくなる。そのた め、図1の実施形態のRD線を各行で独立にすると消費 電力に関して有利である。或いは隣り合う2行のRD線 を共通として、2行毎にRD線を独立にしても、全行共 通に比べて消費電力に関して大変有利である。

(第2の実施形態) 図3は、本発明の第2の実施形態に 係わる固体撮像装置を示す回路構成図である。なお、図 1と同一部分には同一符号を付して、その詳しい説明は 省略する。

【0032】本実施形態が先に説明した第1の実施形態 20 と異なるところは、増幅トランジスタ2のドレインにつ ながる配線が各行独立になっている。そして、隣の行の RD配線15がこの増幅トランジスタ2のドレインの配 線と共通になつている。

【0033】このような構成であっても、各行のRD線 15は独立なので、第1の実施形態と同様に電荷の注入 ・排出によるリセットが可能である。

(第3の実施形態) 図4は、本発明の第3の実施形態に 係わる固体撮像装置を示す回路構成図である。なお、図 1と同一部分には同一符号を付して、その詳しい説明は 30 省略する。

[0034] 本実施形態は第1及び第2の実施形態と異 なり、フォトダイオード1が読み出しトランジスタ16 (16-1, 16-2, 16-3)を介して増幅トラン ジスタ2につながることを特徴とする。なお、図中の1 7 (17-1, 17-2, 17-3) は同一行の読み出 しトランジスタ16のゲートに接続された読み出し線で ある。

【0035】このような構造にすると、増幅トランジス タ2のゲートにつながつている容量である検出容量を小 40 さくできる。セル部の信号の増幅率は配線の容量と検出 部の比で決まるので、増幅率を大きくとるために検出部 の容量は小さいことが望ましい。光利用率を大きくとる ためにはフォトダイオード面積が大きい方がよいが、増 幅トランジスタ2のゲートにフォトダイオード1が直接 つながる場合は、フォトダイオード面積を大きくとると 検出容量も大きくなる。図3の構造は、フォトダイオー ド1が検出部と独立になっているため、フォトダイオー ド面積を大きくして光利用率を大きくしながら、検出部 の検出容量を小さくできるメリットがある。

【0036】この実施形態でもRD線15が各行で独立 になっており、フォトダイオード1のリセットを電荷の 注入排出により行うことでフォトダイオード1での雑音 を小さくできる。

【0037】図5は図4の構成の実施形態においてフォ トダイオードが埋め込みフォトダイオードの構造になつ ている場合の検出部とフォトダイオードの断面図を含む 単位セルの構成図である。電荷読み出し時の電位分布も 合わせて示している。なお、埋込みフォトダイオードは Si表面層がp脳になっており、Si表面で発生する暗 電流を防ぐものである。

【0038】埋め込みフォトダイオードの場合は、読み 出しトランジスタのゲートに十分大きな電圧を加えるな どして信号電荷を完全転送でき、フォトダイオードを完 全空乏化することができる。この場合、完全転送ためK TCノイズは発生しない。しかし、低いゲート電圧では 図5 に示したように電位ポケットができるなどして完全 転送は難しくなる。そのため、読み出しトランジスタを 強反転状態で動作してフォトダイオード1をリセットす ると、2/3KTCノイズが発生する。固体撮像素子の 電源電圧を低くすると低消費電力化はできるが、そのた めに低いゲート電圧でフォトダイオードより信号電荷を 転送する必要がある。

【0039】不完全転送の場合は、本実施形態のように 電荷の注入・排出によるリセットを行うことにより、雑 音を低下させるととができる。また、不完全転送で単純 に電荷読み出すことでフォトダイオードをリセットする という方法では、転送残りが起こり残像が発生する。こ れに対し本実施形態のように、電荷を注入・排出してリ セットすることによりこの残像も無くすことができる。 【0040】図12は、図4の実施形態において水平信 号読出し部にノイズキャンセラを配置した回路構成図で ある。図4に示した構成要素以外に、分離キャバシタ2 1、クランプトランジスタ22が付加されている。図1 2の実施形態でも図4と同様にフォトダイオード1で発 生するKTCノイズを低減し、かつ残像を抑制すること

【0041】図6は、本実施形態における動作を示すタ イミングチャートである。図6(a)では、水平ブラン キング期間に、アドレス線6の電位を"H"にし、RD 線15を "L" にし、リセットゲートを "H" にして電 荷の注入を行う。次いで、RD線15を"H"にし、リ セットゲートを再び "H" にして電荷の排出を行う。そ の後、読み出しゲートをONして信号を読み出す。

ができる。

50

【0042】との動作では、増幅トランジスタ2のゲー トにつながる信号検出部20のリセットが電荷の注入・ 排出で行われている。従って、との動作では信号検出部 20で発生するKTCノイズは1/2KTCに低減され ている。との場合、フォトダイオード1に蓄積された信 号電荷は読み出しトランジスタ16をONすることで完 (6)

全転送するのが望ましい。

[0043]図6(b)では、水平ブランキング期間 に、アドレス線6の電位を"H"にし、RD線15を "L." にし、リセットゲートを "H" にして電荷の注入 を行う。次いで、RD線15を"H"にし、リセットゲ ートを再び"H"にして増幅トランジスタ2のゲート部 の電荷の排出を行う。その後、読み出しトランジスタを ONして信号を読み出す。

【0044】次いで、RD線15を"L"にし、リセッ トゲートを"H"に、読み出しゲートを"H"にしてフ ォトダイオード部の電荷の注入を行う。次いで、RD線 15を"H"にし、リセットゲートを再び"H"に、読 み出しゲートを再び"H"にして電荷の排出を行う。

【0045】この動作では、検出部20とフォトダイオ ード 1 の両方が電荷の注入・排出動作によってリセット されており、KTC雑音が1/2KTCに低減される。 また同時に、フォトダイオードからの信号電荷の不完全 転送で生じる残像を抑制することができる。

【0046】図6(c)では、水平ブランキング期間 に、アドレス線6の電位を"H"にし、RD線15を "H" にし、リセットゲートを "H" にして電荷の排出 を行う。その後、読み出しゲートをONして信号を読み 出す。次いで、RD線15を"L"にし、リセットゲー トを再び"H"に、読み出しゲートをONして電荷の注 入を行う。次いで、RD線15を"H"にし、リセット ゲートを再び"H"に、読み出しゲートをONして電荷 の排出を行う。

【0047】との動作においても、フォトダイオード】 に電荷の注入・排出が行われてリセットされており、K 制される。

【0048】ととで、信号読み出しは、1回行ってもよ いし、ノイズキャンセラを用いて2回読み出すようにし てもよい。 ノイズキャンセラを用いて 2 回読出す場合に ついて、図12も参照して更に詳しく述べる。1回目の 信号読み出しでは信号検出部20はリセットされてお り、信号検出部20のリセットされた電位に対応して電 位に垂直信号線8はなっている。この状態でクランプト ランジスタ22がONされ、信号蓄積部23の電位はク ランプトランジスタのソース電位になっている。この後 40 に、フォトダイオード1の信号電荷が信号検出部20に 読み出され、信号検出部20の電位はその分変化する。 この時の信号検出部20の電位変化は垂直信号線8を通 じて、信号蓄積部23に電位変化を生じる。この後、分 離トランジスタ12がオフされる。従って、この信号読 出しによる信号検出部20の電位変化が信号蓄積部23 に蓄積される。

【0049】このように、ノイズキャンセラを用いて信 号検出部20の信号電荷がないリセット時とその後の信 号電荷読み出し後での電位変化を検出する場合は、信号 50 ることができる。また、負荷トランジスタが無いため、

1.0

検出部20でのKTCノイズは完全に抑圧することがで きるので、信号電荷検出部のリセット手段はリセットト ランジスタ4をKTCノイズが2/3KTCとなる強反 転状態で動作しても構わない。勿論、フォトダイオード に電荷を注入・排出することによって図4の実施形態と 同じ効果が得られる。

(第4の実施形態) 図7は、本発明の第4の実施形態に 係わる固体撮像装置を示す回路構成図である。図におい て図10と同一部分には同一符号を付して、その詳しい 10 説明は省略する。

【0050】本実施形態が図10に示した従来装置と異 なる点は、負荷トランジスタを省略すると共に、増幅ト ランジスタ2のドレインが、各行毎に設置された電荷注 入線201、202、203に各行共通に接続されてい るととである。

【0051】図8に、図7の素子の動作を説明するため の、増幅トランジスタ、垂直選択トランジスタ、及び電 荷注人線の電位図を示した。まず、信号を読み出す行の 垂直選択トランジスタをON状態にした後(a)、選択 20 された行に相当する電荷注入線を"L"レベルにし、増 幅トランジスタのゲートを通して垂直信号線に電荷を注 入する(b)。続いて、電荷注入線電位を再び"H"レ ベルに戻す(c)。垂直信号線電位は増幅トランジスタ のチャネル電位にほぼ等しくなるから、増幅トランジス タのゲート電位に乗っている信号電荷が垂直信号線に呼 び出される。

【0052】図9に素子の動作タイミングを示した。基 本的には前記図11に示す動作と同じであるが、本実施 形態では、アドレスパルス101,102,103に続 TC雑音が1/2KTCに低減されると共に、残像も抑 30 いて、電荷注入線201,202,203にパルスを印 加することが特徴である。

> 【0053】このように本実施形態によれば、増幅トラ ンジスタ2の信号を垂直信号線8に読み出す際に、負荷 トランジスタを使う必要がない。また、そのために負荷 トランジスタで消費される電力を無くすことができ、低 消費電力化をはかることができる。なお、本発明は上述 した各実施形態に限定されるものではなく、その要旨を 逸脱しない範囲で、種々変形して実施することができ る。

[0054]

【発明の効果】以上詳述したように本発明(請求項1. 2) によれば、電荷の注入・排出動作によりフォトダイ オードをリセットすることにより、フォトダイオード部 で発生するノイズを低減させることができ、S/Nの高 い固体撮像装置を実現することが可能となる。

【0055】また、本発明(請求項3)によれば、増幅 トランジスタの信号を垂直信号線に読み出す際に、負荷 トランジスタを使う必要がない。そのため、素子面積を 小さくすることができる。また、素子製造工程を短縮す (7)

特開平9-252434

12

負荷トランジスタで消費される電力を小さくすることが できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】第1の実施形態に係わる固体撮像装置を示す回 路構成図。

【図2】第1の実施形態における動作を示すタイミング チャート。

【図3】第2の実施形態に係わる固体撮像装置を示す回 路構成図。

【図4】第3の実施形態に係わる固体撮像装置を示す回 10 7…リセット線 路構成図。

[図5]第3の実施形態における単位セルの構成を示す 図。

【図6】第3の実施形態における動作を示すタイミング チャート。

【図7】第4の実施形態に係わる固体撮像装置を示す回 路構成図。

[図8]第4の実施形態の動作を説明するための単位セ ルの電位図。

【図9】第4の実施形態の動作を示すタイミングチャー 20 20…信号検出部

【図10】従来のMOS型固体撮像素子の回路図の一

【図11】図4のセンサの動作タイミングチャート。

*【図12】図4の実施形態において水平信号読出し部に ノイズキャンセラを配置した回路構成図。

【符号の説明】

1…フォトダイオード

2…増幅トランジスタ

3…垂直選択トランジスタ

4…リセットトランジスタ

5…垂直シフトレジスタ

6…水平アドレス線

8 …垂直信号線

9…負荷トランジスタ

10…水平シフトレジスタ

11…水平信号線

12…分離トランジスタ

13…增幅容量

15…リセットドレイン配線(RD線)

16…読み出しトランジスタ

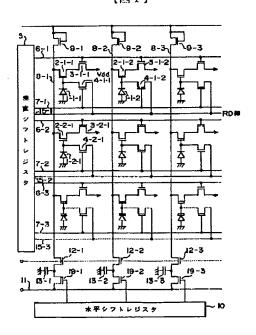
19…水平選択トランジスタ

21…分離キャパシタ

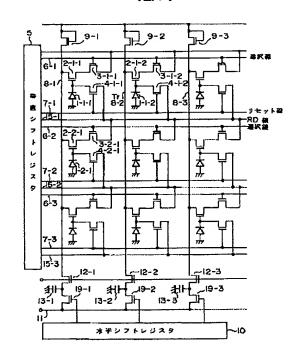
22…クランプトランジスタ

23…信号蓄積部

【図1】



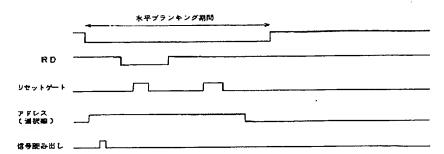
[図3]



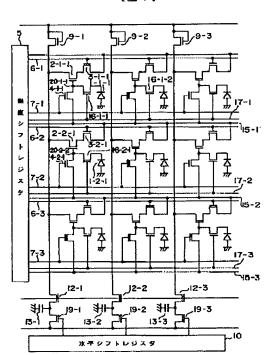
(8)

特開平9-252434

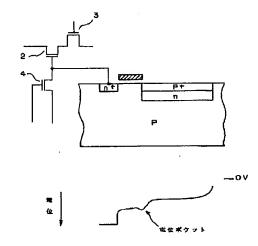
【図2】



FIG, 4



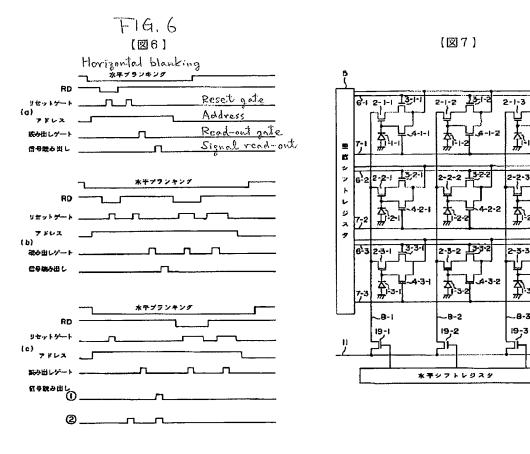
【図5】

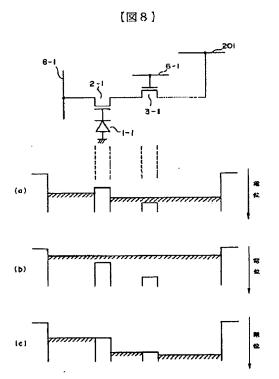


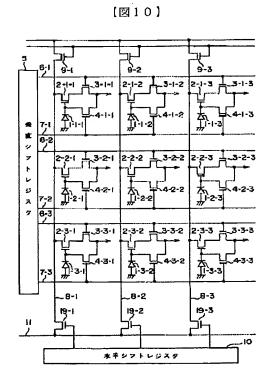


(9)

特開平9-252434



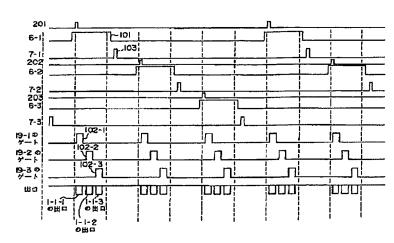




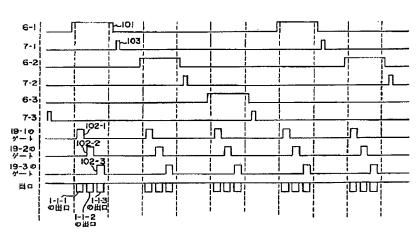
(1.0)

特開平9-252434





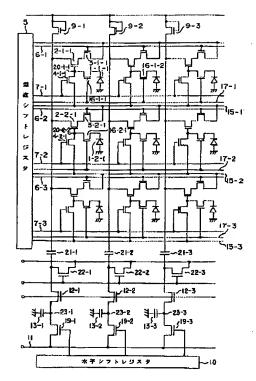
[図11]



特開平9-252434

(11)

[図12]



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:			
☐ BLACK BORDERS			
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES			
☐ FADED TEXT OR DRAWING			
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING			
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES			
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS			
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS			
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT			
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY			
OTHER:			

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.